
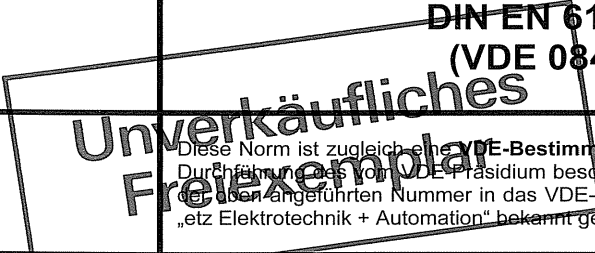



	DIN EN 61000-4-20 (VDE 0847-4-20)	
	Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Durchführung des von der VDE-Präsidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter der oben angeführten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der „etz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden.	

Vervielfältigung – auch für innerbetriebliche Zwecke – nicht gestattet.

ICS 33.100.01

Ersatz für
 DIN EN 61000-4-20
 (VDE 0847-4-20):2008-03
 Siehe Anwendungsbeginn

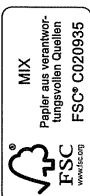
**Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) –
 Teil 4-20: Prüf- und Messverfahren –
 Messung der Störaussendung und Störfestigkeit in transversal-
 elektromagnetischen (TEM-)Wellenleitern
 (IEC 61000-4-20:2010);
 Deutsche Fassung EN 61000-4-20:2010**

Electromagnetic compatibility (EMC) –
 Part 4-20: Testing and measurement techniques –
 Emission and immunity testing in transverse electromagnetic (TEM) waveguides
 (IEC 61000-4-20:2010);
 German version EN 61000-4-20:2010

Compatibilité électromagnétique (CEM) –
 Partie 4-20: Techniques d'essai et de mesure –
 Essais d'émission et d'immunité dans les guides d'onde (TEM)
 (CEI 61000-4-20:2010);
 Version allemande EN 61000-4-20:2010

Gesamtumfang 85 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE



DIN EN 61000-4-20 (VDE 0847-4-20):2011-07

Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn für die von CENELEC am 2010-10-01 angenommene Europäische Norm als DIN-Norm ist 2011-07-01.

Daneben darf DIN EN 61000-4-20 (VDE 0847-4-20):2008-03 noch bis 2013-10-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 61000-4-20 (VDE 0847-4-20):2009-08.

Für diese Norm sind die nationalen Arbeitsgremien UK 767.3 „Hochfrequente Störgrößen“ und UK 767.4 „Geräte und Verfahren zum Messen von elektromagnetischen Aussendungen“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zuständig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde von einer gemeinsamen Arbeitsgruppe des SC 77B „High frequency phenomena“ der IEC und des SC A „Radio interference measurements and statistical methods“ des Internationalen Sonderausschusses für Funkstörungen (CISPR) der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) erarbeitet. Die Federführung liegt beim IEC/SC 77B.

Die Änderungen gegenüber der vorhergehenden Ausgabe der Norm sind am Rand mit einem senkrechten Strich markiert.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (stability date) unverändert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter „<http://webstore.iec.ch>“ zu dieser Publikation angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

- bestätigt,
- zurückgezogen,
- durch eine Folgeausgabe ersetzt oder
- geändert.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 61000-4-20 (VDE 0847-4-20):2008-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Umstrukturierung der Norm; so wurde der bisherige B.2.2 zu 5.2.3 und der bisherige A.6.2 zu A.5.1.2;
- b) In 5.2.2 Erhöhung der Anzahl der Prüfpunkte auf 5 %, für die die sekundäre elektrische Feldkomponente einen Pegel bis zu -2 dB der primären elektrischen Feldkomponente haben dürfen, und Streichung der Festlegung für große TEM-Wellenleiter;
- c) Ergänzung der Anmerkung 2 in 5.2.2 und entsprechende Änderung der Nummern der nachfolgenden Anmerkungen;
- d) Ergänzung der Anmerkung 1 und der Anmerkung 2 in 5.2.3 (vorher B.2.2) und entsprechende Änderung der Nummern der nachfolgenden Anmerkungen;
- e) Überarbeitung des Kalibrierverfahrens für die Gleichförmigkeit des Feldes in 5.2.3 (vorher B.2.2);
- f) Streichung des bisherigen 5.1.3 zu Effekten der Beladung in TEM-Wellenleitern;
- g) Streichung von 5.3 zu Betrachtungen der Messunsicherheit;
- h) Ergänzung der Abschnitte 7 bis 9; zugunsten der Aufnahme von 7.2 zu klimatischen Bedingungen wird C.5.1 gestrichen, und die nachfolgenden Abschnitte werden entsprechend unnummeriert;
- i) Streichung im ersten Absatz von A.3.1, dass bei Meinungsverschiedenheiten das ursprünglich verwendete Verfahren Vorrang besitzt;
- j) Streichung von A.4.2.2 zum Eignungsnachweis des TEM-Wellenleiters für große Prüflinge;
- k) Überarbeitung von B.2.3 zur Validierung des gleichförmigen Feldes im TEM-Wellenleiter für Prüfungen der Störfestigkeit;
- l) Ergänzung eines neuen Anhangs E zur Kalibrierung von Feldsonden und Änderung der Bezeichnung des bisherigen Anhangs E in Anhang F;

m) redaktionelle Überarbeitung der Norm.

Frühere Ausgaben

DIN EN 61000-4-20 (VDE 0847-4-20):2003-10, 2008-03

Nationaler Anhang NA (informativ)

Zusammenhang mit Europäischen und Internationalen Normen

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information über den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben.

Tabelle NA.1

Europäische Norm	Internationale Norm	Deutsche Norm	Klassifikation im VDE-Vorschriftenwerk
–	IEC 60050-161:1990 + A1:1997 + A2:1998	a)	–
–	IEC 60489-1:1983 ^{b)}	DIN IEC 60489-1:1981-07	–
–	IEC 60489-3:1979 (Stand 1983)	DIN IEC 60489-3:1986-11	–
EN 55014-1:2006 + A1:2009	IEC/CISPR 14-1:2005 + A1:2008	DIN EN 55014-1 (VDE 0875-14-1):2010-02	VDE 0875-14-1
EN 55014-2:1997 + Corrigendum 1997 + A1:2001 + A2:2008	IEC/CISPR 14-2:1997 + A1:2001 + A2:2008	DIN EN 55014-2 (VDE 0875-14-2):2009-06	VDE 0875-14-2
EN 55016-1-1:2010 + A1:2010	IEC/CISPR 16-1-1:2010 + A1:2010	DIN EN 55016-1-1 (VDE 0876-16-1-1):2011-06	VDE 0876-16-1-1
EN 55016-1-4:2010	IEC/CISPR 16-1-4:2010 + Corrigendum:2010	DIN EN 55016-1-4 (VDE 0876-16-1-4):2011-03	VDE 0876-16-1-4
EN 55016-2-3:2006 zurückgezogen, ersetzt durch:	IEC/CISPR 16-2-3:2006 zurückgezogen, ersetzt durch:	DIN EN 55016-2-3 (VDE 0877-16-2-3):2007-08 zurückgezogen, ersetzt durch:	VDE 0877-16-2-3
EN 55016-2-3:2010 + A1:2010	CISPR 16-2-3:2010 + A1:2010	DIN EN 55016-2-3 (VDE 0877-16-2-3):2011-03	VDE 0877-16-2-3
–	IEC/CISPR/TR 16-4-1:2009	–	–
EN 55016-4-2:2004	IEC/CISPR 16-4-2:2003	DIN EN 55016-4-2 (VDE 0876-16-4-2):2005-09	VDE 0876-16-4-2